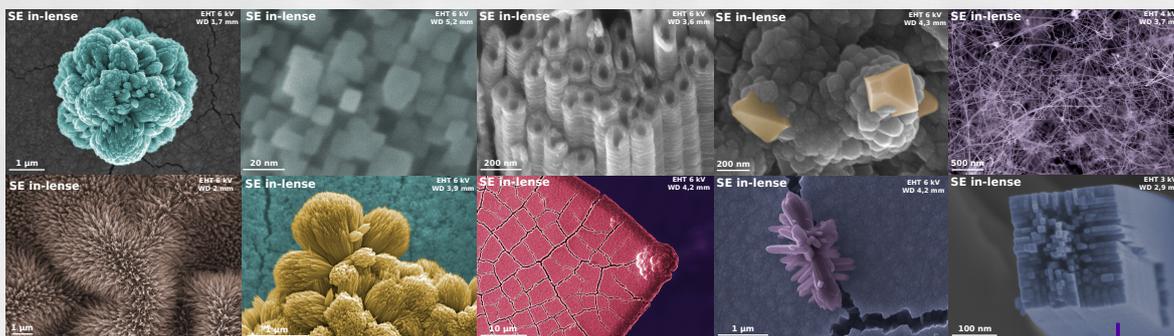




PLATE-FORME MEB-CRO

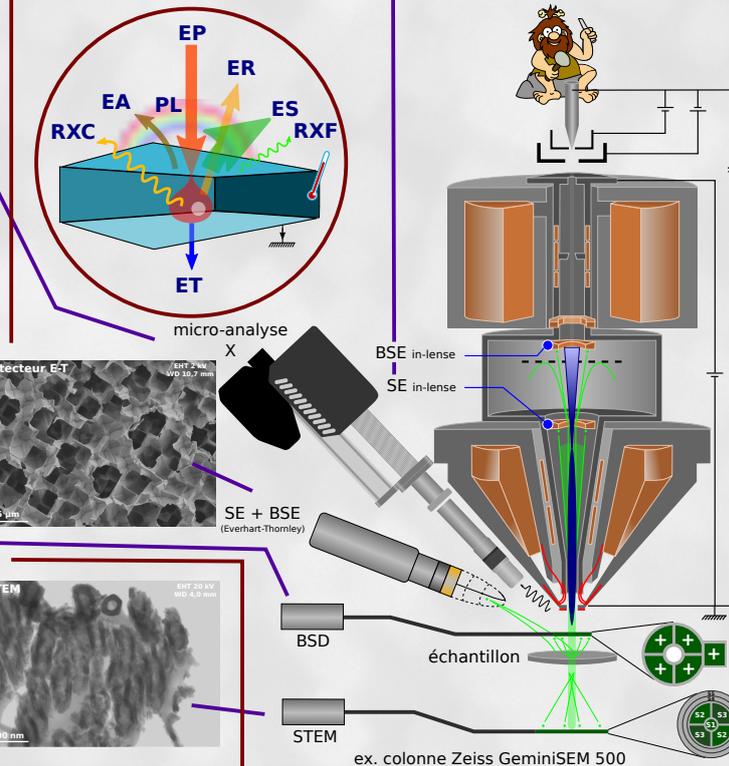
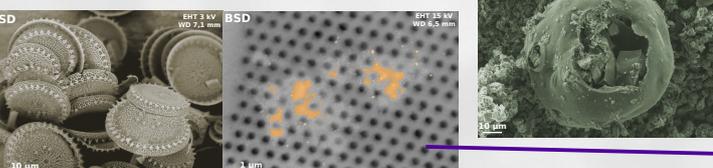
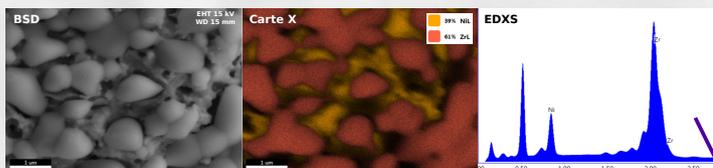


Thierry DINTZER
ICPEES, 03.68.85.27.53
thierry.dintzer@unistra.fr

Tom FERTÉ
IPCMS, 03.88.10.71.14
tom.ferte@ipcms.unistra.fr

Cédric LEUVREY
IPCMS, 03.88.10.71.26
cedric.leuvre@ipcms.unistra.fr

Thierry ROMERO
ICPEES, 03.68.85.26.47
thierry.romero@unistra.fr



JEOL 6700F (2001)

- IPCMS, laboratoire n°0036
- FEG froid
 - Détecteur Everhart-Thornley
 - Détecteur in-lense
 - Détecteur rétractable 2 segments
 - Détecteur STEM
 - Détecteur EDXS SiLi 30 mm²



Tescan Vega III (2012)

- ECPM, bâtiment R1, niveau 1
- Filament de W
 - Détecteur Everhart-Thornley
 - Détecteur rétractable YAG
 - Pression partielle 3 à 500 Pa
 - Très grande distance de travail
 - Excellente profondeur de champ



Zeiss GeminiSEM 500 (2016)

- ECPM, bâtiment R1, niveau 1
- FEG Schottky
 - Détecteur Everhart-Thornley
 - 2 Détecteurs in-lense
 - 2 Détecteur rétractable 5 segments
 - Détecteur STEM
 - Détecteur EDXS SDD 30 mm²
 - Détecteur de photoluminescence
 - Pression partielle 3 à 500 Pa
 - Plasma cleaner

Autres moyens de la plate-forme

- Évaporateurs de C, Au, Ir
- Microscopes optiques
- Polissoirs mécaniques ou ioniques
- Bombardement ionique pour nettoyage ou coupe
- Encadrement d'une formation CFE annuelle



Hitachi IM4000+ ion beam polisher

